

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- С. Н. Гузевич.** Условия достоверности навигационных измерений и геометризации их описания 3

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

- Ю. В. Ларионов.** Условия измерений ширины выступа растровым и просвечивающим электронными микроскопами в диапазоне менее 50 нм 12

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- М. Н. Сурду.** Вариационный метод калибровки измерителей импеданса.
Ч. 1. Основные положения 27
- М. Н. Сурду.** Вариационный метод калибровки измерителей импеданса.
Ч. 2. Реализация метода 44